

# JEITA

電子情報技術産業協会規格

Standard of Japan Electronics and Information Technology Industries Association

*JEITA RC-2530B*

**電子機器用及び通信機器用  
表面実装固定インダクタ**

**Fixed surface mount inductors for use in electric  
and telecommunication equipment**

1993 年 10 月制定

2001 年 11 月改正

2009 年 3 月改正

作 成

受動部品標準化専門委員会

Technical Standardization Committee on Passive Components

発 行

社団法人 電子情報技術産業協会

Japan Electronics and Information Technology Industries Association

## 目 次

	ページ
1 適用範囲 .....	1
2 引用規格 .....	1
3 用語及び定義 .....	2
4 図記号及び形名 .....	2
4.1 形名 .....	2
5 形状 .....	4
6 寸法 .....	5
6.1 形状 D .....	5
6.2 形状 K .....	6
6.3 外形及び高さ寸法の許容差 .....	6
7 定格及び特性 .....	7
7.1 公称インダクタンス又はインピーダンス .....	7
7.2 公称インダクタンス又はインピーダンスの許容差 .....	7
7.3 使用温度範囲（カテゴリ温度範囲） .....	7
8 表示 .....	8
9 極性の方向を示す表示又は形状 .....	8
10 試験及び要求性能 .....	9
10.1 試験の状態 .....	9
10.1.1 標準状態 .....	9
10.1.2 判定状態 .....	9
10.2 外観及び寸法 .....	9
10.2.1 外観 .....	9
10.2.2 寸法 .....	9
10.3 電氣的性能試験 .....	9
10.3.1 インダクタンス .....	9
10.3.2 $Q$ .....	13
10.3.3 インピーダンス .....	16
10.3.4 自己共振周波数 .....	16
10.3.5 直流抵抗 .....	17
10.3.6 定格電流 .....	18
10.4 機械的性能試験 .....	18
10.4.1 基板への取付け .....	18
10.4.2 本体強度 .....	18
10.4.3 端子強度（電極強度） .....	18
10.4.4 はんだ付け性 .....	18
10.4.5 はんだ耐熱性 .....	19
10.4.6 電極の耐はんだ食われ性 .....	19

10.4.7	振動試験	19
10.4.8	耐衝撃性	19
10.5	耐環境性試験	20
10.5.1	低温試験	20
10.5.2	高温試験	20
10.5.3	温度サイクル	21
10.5.4	高温高湿	21
10.5.5	耐溶剤性	22
	参考文献	22
	解説	23

## まえがき

この規格は、社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）電子部品部 標準化委員会 受動部品標準化専門委員会 高周波コイルグループが作成したものである。

この規格は、著作権法によって保護されている著作物であるため、許可なくこの規格の一部又はすべてを複製・転載することを禁止する。

この規格は、この規格の一部が、工業所有権（特許権、実用新案権、意匠権など）に抵触する可能性に関係なく制定されている。社団法人 電子情報技術産業協会は、このような工業所有権に係る確認について、責任はもたない。

この規格は、**JEITA TSC-16**（電子情報技術産業協会規格類の作成基準）の様式によって作成した個別規格である。

## 電子情報技術産業協会規格

# 電子機器用及び通信機器用表面実装固定インダクタ

## Fixed surface mount inductors for use in electric and telecommunication equipment

### 1 適用範囲

この規格は、電子機器用及び通信機器用に使用する表面実装固定インダクタ（以下、インダクタという。）及びフェライトビーズに適用する。

この規格は、インダクタの推奨する定格及び特性について規定するとともに、適切な試験方法及び測定方法、さらに、一般要求性能について規定する。

### 2 引用規格

次に掲げる規格は、この規格に引用されることによって、この規格の規定の一部を構成する。

これらの引用規格のうちで、西暦年を付記してあるものは、記載の年の版を適用し、その後の改正版（追補を含む。）には適用しない。西暦年の付記がない引用規格は、その最新版（追補を含む。）を適用する。

**JIS B 7502:1994** マイクロメータ

**注記** 対応国際規格：ISO 3611:1978, Micrometer callipers for external measurement (NEQ)

**JIS B 7507:1993** ノギス

**注記** 対応国際規格：ISO 3599:1976, Vernier callipers reading to 0,1 and 0,05 mm (NEQ) 及び ISO 6906:1984, Vernier callipers reading to 0,02 mm (NEQ)

**JIS C 0025:1988** 環境試験方法（電気・電子）温度変化試験方法

**注記** 対応国際規格：IEC 60068-2-14:1984, Environmental testing – Part 2: Tests – Tests N: Change of temperature 及び Amendment 1:1986 並びに IEC 60068-2-33:1971, Environmental testing – Part 2: Tests. Guidance on change of temperature tests 及び Amendment 1:1978 (MOD)

**JIS C 5602** 電子機器用受動部品用語

**JIS C 5604** 電子機器及び通信機器用固定インダクター表示記号

**注記** 対応国際規格：IEC 61605:2005, Fixed inductors for use in electronic and telecommunication equipment – Marking codes (IDT)

**JIS C 60068-1:1993** 環境試験方法－電気・電子－通則

**注記** 対応国際規格：IEC 60068-1:1988, Environmental testing – Part 1: General and guidance (IDT)

**JIS C 60068-2-1** 環境試験方法－電気・電子－低温（耐寒性）試験方法

**注記** 対応国際規格：IEC 60068-2-1:2007, Environmental testing – Part 2-1: Tests – Tests A: Cold (IDT)

**JIS C 60068-2-2** 環境試験方法－電気・電子－高温（耐熱性）試験方法

**注記** 対応国際規格：IEC 60068-2-2:2007, Environmental testing – Part 2-2: Tests – Tests B: Dry heat (IDT)

**JIS C 60068-2-58:2005** 環境試験方法－電気・電子－表面実装部品（SMD）のはんだ付け性、電極のはんだ食われ性及びはんだ耐熱性試験方法

**注記** 対応国際規格：IEC 60068-2-58:2004, Environmental testing – Part 2-58: Tests – Test Td: Test method for solderability, resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of surface mounting devices (SMD) (MOD)